MAQNETRON TOZLANMA ÜSULU İLƏ ALINMIŞ Cu2ZnSnSe4 ƏSASLI HETEROQURULUŞUN ELLİPSOMETRİK TƏDQİQİNİN APARILMASI

S.G. NURİYEVA

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutu Bakı, Azərbaycan, AZ-1143, H.Cavid pr., 131 snur_phyicist@mail.ru

Cu₂ZnSnSe₄ kristalından əzilərək alınmış nanotozdan preslənərək düzəldilmiş 10 sm diametrli hədəfin maqnetron tozlandırılması üsulu ilə şüşə altlıq üzərində alınmış nazik, qalınlığı təqribən 100 nm tərtibində olan Cu₂ZnSnSe₄ təbəqəsinin ellipsometrik tədqiqatı aparılmışdır. Göstərilmişdir ki, təbəqənin qadağan olunmuş zonasının eni $E_g=1,6$ eV, yüksək enerji xüsusiyyətləri isə 4 eV və 4,6 eV təşkil edir. Təcrübə nəticələri GW kvazi-hissəcik yaxınlaşması çərçivəsində hesablanmış ε -spektri ilə yaxşı uzlaşır və müəyyən olunan yüksək enerji xüsusiyyətlərinin mümkün mənşəyini müəyyənləşdirir.

Açar sözlər: UVN-71P vakuum qurğusu, Cu₂ZnSnSe₄, maqnetron, J.A. Woollam VASE ellipsometr qurğusu, ellipsometrik tədqiqat, qadağan olunmuş zonanın eni, CZTS, yüksək udma əmsalı, kesterit quruluş, nazik təbəqələr, sındırma əmsalı, ekstinksiya əmsalı, riyazi modelləşdirmə, ε - spektr, dielektrik funksiya, yüksək enerji xüsusiyyətləri. PACS: 71.15.Mb,88.40.fc,88.40.jn

1. GİRİŞ

Hələ XX əsrin 60-70-ci illərində üzvi yanacaq ehtiyatlarının aşkar şəkildə tükənməsi ilə əlaqədar olaraq günəs enerjisinin fotovoltaik ceviricilərinə yaranan maraq müxtəlif günəş batareyalarının yaranmasına gətirib çıxardı. Bu, yeni, perspektivli və bərpa olunan enerji mənbələrinin tapılması zərurətini yaratdı. Hal-hazırda nisbətən perspektivli və sürətlə inkişaf edən günəş batareyaları kesterit tipli kristallik quruluşa malik Cu₂ZnSn(SSe)₄ beşqat birləşmələrinin uducu təbəqələri əsasında olan günəş batareyalarıdır. Kesterit tipli kristallik quruluşa malik olan bu materiallarda energetik zona quruluşu düz keçidli olmaqla qadağan olma zolağı (E_g) , onların tərkibindən asılı olaraq 0.8-1.7 eV aralığında dəyişir və udma əmsalı 104sm-1 qiymətindən yüksəkdir. Nazik təbəqəli Cu2ZnSnS4 (CZTS) və Cu2ZnSnSe4 (CZTSe) birləşmələri əsasında yaradılmış fotovoltaik çeviricilərə bu gün böyük ehtiyac vardır. Ucuz başa gələn Günəş elementləri üçün bunlar ən perspektivli materiallardan sayılırlar. Bu dördqat birləşmələrin tərkibinə daxil olan materiallar az toksikdirlər və təbiətdə geniş yayılmışdır. Qısa tarixə malik olmasına baxmayaraq, CZT(S,Se) texnologiyaları sürətlə inkişaf edir və indiki zamanda bəzi laboratoriyalarda fotoçeviriciliyin F.İ.Ə. 10,1% olan Günəş Elementləri düzəldilmişdir [1-13]. Nəzəri F.İ.Ə. isə 32 %-dir. Cu₂ZnSn(SeS)₄ birləşmələri p-tip elektrik keçiriciliyə malikdir, bu da mono- və heterokeçidlər əsasında günəş batareyaları yaratmaq üçün n-tip keçiriciliyə malik CdS, CdZnS, ZnO, ZnO:Al kimi n-tip keçiriciliyə malik aktiv təbəqələrdin istifadə etmək üçün imkanlar yaradır. Ancaq təəccüblü olsa da, CZTSe-nin xüsusiyyətləri hələ ətraflı araşdırılmamışdır. Xüsusilə, təcrübi tədqiqatlar nisbətən azdır. Dielektrik funksiyalar $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 i = N^2$ və refraktiv indeks kimi materialların optik xüsusiyyətlərini bilmək $N=n+ik=[\varepsilon]^{(1/2)}$, Fotovoltaik (PV) cihaz quruluşunu inkişaf etdirmək və optimallaşdırmaq, eyni zamanda elektron quruluş və əlaqəli fiziki xüsusiyyətlər haqqında anlayışımızı yaxşılaşdırmaq üçün vacibdir. Məsələn, N (və ya ε) giriş parametrlərindən biridir. PV cihazının işinin optik modelləşdirilməsi və ε - spektrlər elektron quruluş hesablamaları ilə edilən proqnozları doğrultmaq üçün geniş istifadə olunur. Burada CZTSe'nin optik xüsusiyyətlərini araşdırmaq üçün spektroskopik ellipsometriya (SE) tətbiq edirik. SE geniş spektral diapazonda olan materialların ε və N spektrlərini müəyyənləşdirmək üçün olduqca uyğun bir metod kimi tanınır. Bu texnikanın səthə həssaslığı, əksər hallarda səth örtükləri olduqda materialın daxili xüsusiyyətlərini əldə etməyi çətinləşdirir. Çünki kifayət qədər məlumat olmadan SE məlumatlarının riyazi modelləşdirilməsi potensial olaraq qeyri-dəqiq ola bilər.

2. NÜMUNƏNİN ALINMASI VƏ TƏCRÜBƏLƏRİN METODİKASI



Bütöv alt və qövsvari üst kontakt üçün nazik Mo təbəqələri optik şüşə üzərinə arqon qaz mühitində maqnetron tozlandırılması üsulu ilə çəkilmişdir. Cu₂ZnSnSe₄ (CZTSe) nazik təbəqələri isə, bir hissəsi şüşə oturacağa düşməklə, Mo təbəqəsi üzərinə tozşəkilli Cu₂ZnSnSe₄ materialının Ar qaz mühitində, otaq temperaturunda maqnetron tozlandırılması üsulu ilə modifikasiya edilmiş UVN-71P vakuum qurğusunda çəkilmişdir. Həmin qurğuda termik buxarlandırma üsulu ilə CdS nazik təbəqələri Cu₂ZnSnSe₄ üzərinə çökdürülmüşdür [1-3].

Maqnetron tozlandırılması ~ 300 - 600 V gərginliyə və ~ (3-5) A cərəyan şiddətnə malik qaz boşalmasında baş verir. Ölçüləri 20mm×20 mm olan şüşə oturacaq üzərində maqnetron tozlandırılması üsulu ilə otaq temperaturunda çəkilmiş CZTSe nazik təbəqələrin Ellipsometrik tədqiqatı həyata keçirilmişdir. SE ölçmələri otaq temperaturunda spektroskopik ellipsometrdən (J.A. Woollam VASE) istifadə edərək aparılmışdır [1-13]. Ellipsometrik parametrlər fotonun (1.03 ilə 6.4 eV) enerji aralığında və 65° bucaq altında əldə edilmişdir.

Cu₂ZnSnSe₄ əsasında nazik təbəqəli Mo/Cu₂ZnSnSe₄ /CdS/Mo heteroquruluşları şüşə altlıq üzərində elə çökdürülmüşdür ki, heteroquruluşlar və nazik təbəqənin fiziki xassələrini, optik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək mümkün olsun. Nümunələr Fizika İnstitutunun "Heteroquruluşların fizikası" laboratoriyasında maqnetron tozlandırma üsulu ilə şüşə altlıq üzərində alınmışdır. ES tədqiqatları aparılan nazik Cu2ZnSnSe4 təbəqəsinin qalınlığı təqribən 100 nm tərtinindədir. Maqnetron tozlandırma zamanı şüşə altlığın bir hissəsində yalnızca maddə (Cu₂ZnSnSe₄) çökdürülmüşdür, digər hissələrində isə Mo, onun üzərinə maddə (Cu2ZnSnSe4) və üzərinə də CdS və Mo kantaktından ibarət nazik təbəqələr formalaşdırılmışdır [1-17]. Nümunələrin quruluşu ES tədqiqatlarını şüşə üzərində Cu2ZnSnSe4 və molibden təbəqəsi üzərinə hopdurulmuş Cu2ZnSnSe4 təbəqəsində aparmaq mümkün idi.

3. NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ. 3.1. Cu₂ZnSnSe₄ kesterik quruluşlu yarımkeçiricinin maqnetron tozlandırma üsulu ilə şüşə altlıq üzərinə çəkilmiş nazik təbəqəsinin ellipsometrik tədqiqi:

SE ölçmələri otaq temperaturunda bucaq altında spektroskopik ellipsometrdən (J.A. Woollam VASE) istifadə edərək aparıldı. Ellipsometrik parametrlər fotonun (1.03 ilə 6.4 eV) enerji aralığında və $65^0 - d$ ə əldə edilmişdir. Presedurdan sonra oksidlərin təsiri və kənar təsirlər minimuma endirilmiş, alınan nəticələrdə əlavə təsirlərdən yaranan kənaraçıxmalar aradan qaldırılmışdır [7-15]. Alınmış nəticələr əsasında psevdo dielektrik funksiyaları riyazi modelləşdirilmiş və daha sonra dielektrik funksiyalarının (ε_1 və ε_2) enerjidən aslılıq qrafikləri qurulmuşdur (şəkil 3.):



Şəkil 3. Cu₂ZnSnSe₄ əsaslı nazik təbəqənin $\varepsilon_1 v \bar{v} \varepsilon_2$ dielektrik funksiyalarının enerjidən aslılığı.

Aslılıq qrafikindən $\varepsilon(E)$ funksiyasının E_0 , E_{1A} , E_{1B} enerjilərindəki uyğunsuzluqlara baxmayaraq forma, demək olar ki, eynidir. Cu₂ZnSnSe₄ nazik təbəqəsinin fundamental udma kənarının, $E_0 = E_g$ - (qadağan olunmuş zonanın eninin 1.6 eV) olduğu müəyyən olunur. Eyni zamanda, yüksək enerji xüsusiyyətləri $E_{1A}(4,4eV)$ və $E_{1B}(5,5eV)$ enerji səviyyələrində qeydə alınmışdır. Ellipsometrik tədqiqatlar nəticəsində alınmış psevdo dielektrik funksiyası riyazi modelləşdirilərək $\varepsilon(E) = \varepsilon_1(E) + \varepsilon_2(E)$, E_0 , E_{IA} , E_{IB} enerjiləri əldə olunmuşdur. Deyilənləri nəzərə alaraq (1) ifadəsini yaza bilərik:

$$\varepsilon(E) = \varepsilon^0(E) + \varepsilon^1(E) + \varepsilon_{1\infty}(E) \qquad (1)$$

Burada 1-ci və 2-ci hədlər əsas enerji səviyyəsində yerləşən bir elektronla bağlıdır. Burada E_0 və yüksək enerji keçidləri mövcuddur. $E_{1\beta}(\beta = A, B)$ uyğun olaraq $\varepsilon_{1\infty}(E)$ - qalan elektron keçidləri ilə müəyyən edilr. $\varepsilon^0(E)$ üçün üç ölçülü (3D) CP uyğun keçidlər:

$$\varepsilon^{0}(\mathbf{E}) = A \mathbf{E}_{0}^{-3/2} \chi_{0}^{-2} (2 - (1 + \chi_{0})^{1/2} - (1 - \chi_{0})^{1/2})$$
(2)

Beləki, $\chi_0 = (E + i\Gamma_0)/E_0$, burada A və Γ_0 , E_0 enerjisinə uyğun olaraq gücü və sönmə sabitini göstərir.

 $\varepsilon^{1}(E)$ müvafiq olaraq 2D- M_{0} və 2D- M_{1} CP - lərdə E_{1A} , E_{1B} - nin daha yüksək keçidlərini hesablamağa imkan verir. Belə ki,

$$\varepsilon^{1}(\mathbf{E}) = B_{1A} \Big[1 - (E/E_{1A})^{2} - i(E/E_{1A})\Gamma_{1A} \Big]^{-1} - B_{1B} \chi_{1B}^{-2} \ln(1 - \chi_{1B}^{2})$$
(3)

Burada B_{1A} və Γ_{1A} , E_{1A} – enerjisinə uyğun; B_{1B} və Γ_{1B} , E_{1B} – enerjisinə uyğun ölçüsuz güc və sönmə sabitləridir ($\chi_0 = (E + i\Gamma_0)/E_0$). Dielektrik funksiya üçün Adachi modelinin (MDF) parametrlərini hesablamaq üçün Tablama İmitasiya (Tİ) alqoritmi istifadə edilmişdir. Tİ alqoritmindən istifadə etməklə MDF parametrləri minimuma endirərək axtarılan funksiyanı yaza bilərik.

$$F = \sum_{i=1}^{N} \left(\left| \frac{\varepsilon_1(E_i)}{\varepsilon_1^{\exp t}(E_i)} - 1 \right| + \left| \frac{\varepsilon_2(E_i)}{\varepsilon_2^{\exp t}(E_i)} - 1 \right| \right)^2$$
(4)

Burada $\varepsilon_1(E_i)$, $\varepsilon_1^{expt}(E_i)$, $\varepsilon_2(E_i)$, $\varepsilon_2^{expt}(E_i)$ uyğun olaraq (E_i) nöqtəsində ekspermental olaraq hesablanmış kompleks dielektrik funksiyasının həqiqi və xəyali hissələridir. Burada *N* - təcrübi nöqtələrin sayıdır. Bildiyimiz kimi, dielektrik funksiyaları ilə sındırma əmslı arasında aşağıdakı əlaqə mövcuddur:

 $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 i = N^2$; $N = n + ik = [\varepsilon]^{\frac{1}{2}}$

Burada *n*- sındırma əmsalının həqiqi hissəsi *k* - isə xəyali hissəsi yəni, ekstinksiya əmsalıdır. Dielektrik funksiyalarla sındırma əmsalı arasındakı əlaqəyə əsasən dielektrik funksiyalarının qiymətləri düsturda nəzərə alınmışdır və sındırma əmsalının həqiqi hissəsinin və ekstinksiya əmsalının qiymətləri təyin olunmuşdur. Nəticədə, onların enerjidən asılılıq qrafikləri xüsusi proqramın köməyi ilə qurulmuşdur (şəkil 4.).



Şəkil 2. Cu₂ZnSnSe₄ nazik təbəqəsində *n* və *k*-nın enerjidən aslılıq qrafikləri

- H.H. Абдулзаде, Н.А. Алиев, Д.А. Ахмедова, С.Ш. Кахраманов, Н.Н. Мурсакулов. Dielektrik function spectra and critical - point energies of Cu₂ZnSnSe₄ from 0.5 to 9.0eV. National Renewable Energy Laboratory, Golden, Colorado 80401, USA 3 February 2012.
- [2]. N.N. Abdulzadə, И.И. Алиев, П.А. Аскерова, Д.А.Ахмедова, Н.Н. Мурсакулов, Ч.Э. Сабзалиева, А.К.Заманова. Физико-химическое исследование систмы Cu₂SnS₃-ZnS, синтез Cu₂ZnSnS₄ и их наноразмерных пленок для солнечных элементов. Х Международная научно-техническая конференця «Микро- и нанотехнологии в электронике», 5с. 2018.
- [3]. N.N.Abdulzade, S.Q. Nuriyeva, G.T.∂skərxanova, N.N.Mursakulov. AJP FİZİKA 2020, volume XXVI №1, section:Az səh.53-57.
- [4]. N.N. Mursakulov S.G. Nuriyeva N.N. Abdulzade Kh.M. Guliyeva. DC magnetron sputtering deposition of Cu₂ZnSnSe₄ thin films for solar cell fabrication./ The 17th International Conference on "Technical and Physical Problems of Engineering" 18-19 October 2021 Istanbul Rumeli University, Number 14, Pages 67-71
- [5]. N.N. Mursakulov, S.G. Nuriyeva, N.N. Abdulzade, Ch.E. Sabzaliyeva. Cu2ZnSnSe4 thin film based solar cells obtained by magnetron sputtering method. 7th International Conference MTP –

Bu qrafikdə; n - sındırma əmsalının və k – ekstinksiya əmsalının enerjidən aslılıq qrafikindən alınan nəticələrə baxdığımız zaman görürük ki, qrafikdən alınan nəticələr Cu₂ZnSnSe₄ əsasında nazik təbəqəli Cu₂ZnSnSe₄ üçün əldə etdiyimiz əvvəlki nəticələrlə uyğunluq təşkil edir. Yəni, Cu₂ZnSnSe₄ nazik təbəqəsində E_g =1,6 eV, yüksək enerji xüsusiyyətləri isə 4 eV və 4,6eV enerjilərində müəyyən olunur [7-15].

4. ΝƏΤİCƏ

- Cu $_2$ ZnSnSe $_4$ nazik təbəqələri maqnetron tozlandırılma üsulu ilə alınmışdır.

- (1.03 ilə 6.4 eV) enerji aralığında və 65°-də spektroskopik ellipsometrdən (J.A. Woollam VASE) istifadə edərək SE ölçmələri nəticəsində otaq temperaturunda nazik Cu₂ZnSnSe₄ təbəqələrinə aid n və k əmsallarının enerjidən asılılıq qrafiki qurulmuşdur.

- Prosedurdan sonra oksidlərin təsiri və kənar təsirlər minimuma endirilərək, alınan nəticələrdə əlavə təsirlərdən yaranan kənaraçıxmaları aradan qaldırmaqla qeyd olunmuş nəticələr əsasında psevdo dielektrik funksiyaları üçün riyazi modelləşdirilmə aparılmış, və daha sonra nazik Cu₂ZnSnSe₄ təbəqələrinin dielektrik funksiyalarının (ε_1 və ε_2) enerjidən aslılıq qrafikləri qurulmuşdur.

- Nazik Cu₂ZnSnSe₄ təbəqələrində deielektrik funksiyalarla sındırma əmsalı arasındakı əlaqəyə əsasən sındırma əmsalının həqiqi hissəsinin və ekstinksiya əmsalının qiymətləri düsturdan təyin olunmuşdur. Nəticədə, onların enerjidən aslılıq qrafikləri xüsusi proqramın köməyi ilə qurulmuşdur.

2021: Modern Trends Physics.December 15-17,2021. p 83-84.

- [6]. N.N. Mursakulov, S.G. Nuriyeva, N.N. Abdulzade, Kh.M. Guliyeva. International Journal on "Technical and Physical Problems of Engineering" (IJTPE) Issue 50, Volume 14, Number 1, March 2022, pp156 – 160
- [7]. S.G. Choi, H.Y. Zhao, C. Persson. Dielectric function spectra and critical point energies of Cu2ZnSnSe4 from 0,5 to 9,0 eV. Appl. Phys, 111, 2012, p. 033506 (1-6).
- [8]. D. Barkhouse, O. Gunawan, T. Gokmen, T. Todorov and D. B. MitziAppl. Phys. Lett. 100, 253905, 2012.
- [9]. S. Ahn, S. Jung, J. Gwak, A. Cho, K. Shin, K. Yoon, D. Park, H. Cheong, and J. H. Yun. Appl. Phys. Lett. 97, 021905, 2010.
- [10]. A. Redinger, K. Ho'nes, X. Fontane', V. Izquiero-Roca, E. Saucedo, N. Valle, A. Pe'rez-Rodr'iguez and S. Siebentritt. Journal of Applied Physics, 2015, 118, 185302.
- [11]. Repins, N. Vora, C. Beall, S.-H. Wei, Y. Yan, M. Romero, G. Teeter, H. Du, B. To, M. Young, and R. Noufi. Journal of Applied Physics 111, 033506 (2012)
- [12]. N. Vora, I. Repins, C. Beall, B. To, G. Teeter, J. Blackburn, J. Pankow, and R. Noufi. Journal of

Vacuum Science & Technology. 2012, A 30, 051201.

- [13]. S. Y. Chen, X. G. Gong, A. Walsh, and S. H. Wei. Phys. Lett., 2009, 94, 041903.
- [14]. S. Schorr, Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 2011, 95, 1482.
- [15]. M. León, S. Levcenko, R. Serna, I. V. Bodnar, A. Nateprov, M. Guc, G. Gurieva, N. Lopez, J. M. Merino, R. Caballero, S. Schorr, A. Perez-

Rodriguez and E. Arushanov. Appl. Phys. Lett., 2014, 105(6), 061909.

- [16]. G. Zoppi, I. Forbes, R. W. Miles, P. J. Dale, J. J. Scragg and L. M. Peter. Prog. Photovolt. Res. Appl. 2009, 17(5), 315–319.
- [17]. A. Redinger, M. Mousel, R. Djemour, L. Gütay, N. Valle, and S. Siebentritt. Prog. Photovolt. Res. Appl. 2014, 22(1), 51–57.

S.Q. Nuriyeva

ELLIPSOMETRIC EXPLORE OF Cu₂ZnSnSe₄ BASED HETERO-STRUCTURE MADE BY MAGNETRON

An ellipsometric study of a thin $Cu_2ZnSnSe_4$ film with a thickness of about 100 nm, obtained on a glass substrate by magnetron sputtering of a target 10 cm in diameter, made by pressing a nanopowder obtained by crushing a $Cu_2ZnSnSe_4$ crystal, has been carried out. It is shown that the band gap of $Cu_2ZnSnSe_4$ is 1.6 eV, and the high-energy regions are (4 - 4.6) eV. The experimental results are in good agreement with the ε -spectrum calculated in the framework of the GW quasi-particle approximation, and possible causes of the revealed high-energy properties are established.

С.Г. Нуриева

ЭЛЛИПСОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ Cu₂ZnSnSe₄, полученной методом магнитронного напыления

Проведено эллипсометрическое исследование тонкой пленки Cu₂ZnSnSe₄ толщиной около 100 нм, полученной на стеклянной подложке методом магнетронного распыления мишени диаметром 10 см, изготовленной прессованием нанопорошка, полученного дроблением кристалла Cu₂ZnSnSe₄. Показано, что ширина запрещенной зоны Cu₂ZnSnSe₄ составляет 1,6 эB, а высокоэнергетические области — (4 - 4,6) эB. Экспериментальные результаты хорошо согласуются с *ε*-спектром, рассчитанным в рамках квазичастичного приближения ГВ, и установлены возможные причины выявленных высокоэнергетических свойств.результаты хорошо согласуются с *ε*-спектром, рассчитанным в рамках квазичастичного приближения GW, и установлены возможные причины выявленных высокоэнергетических свойств.

Qəbul olunma tarixi: 16.06.2022